



MICROSCOPIE À FORCE ATOMIQUE (AFM)

FABRICANT : VEECO

MODÈLE : Nanoscope IIIa

Analyses

- Modes : contact, contact intermittent (tapping)
- Plage de balayage : 120 μm (X-Y), 5 μm (Z)
- Résolution en profondeur : 0.01 nm
- Résolution latérale : 0.1 nm